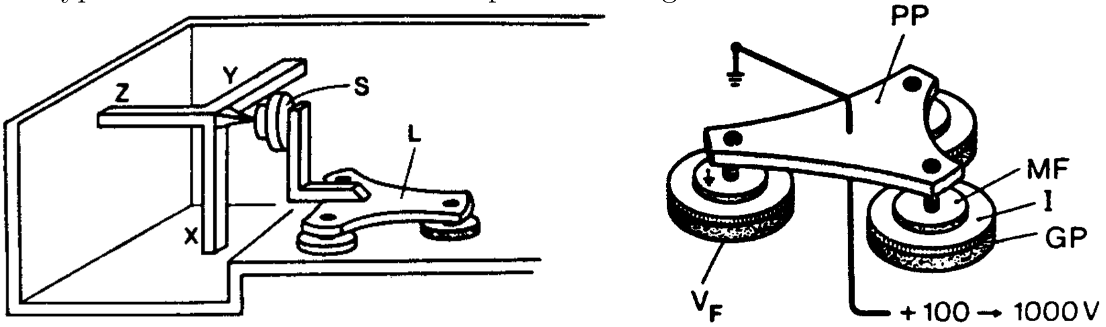
Inhaltsübersicht (vorläufig)

---

1. Raster-Sonden-Mikroskopie (SPM): STM und AFM

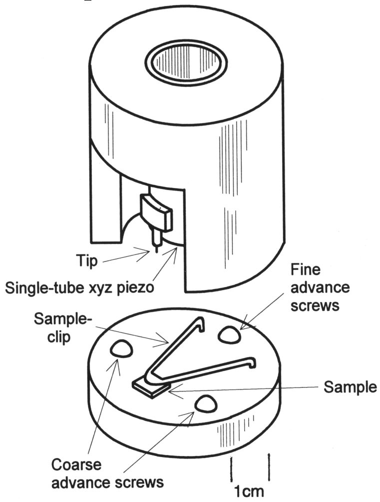
Apparatives

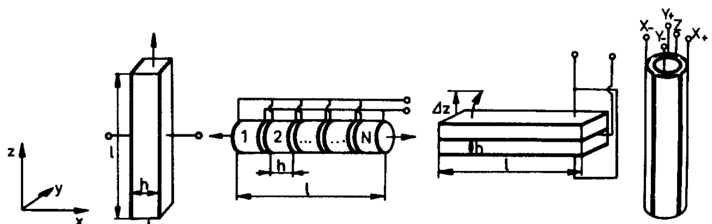
Prototyp des Raster-Tunnel-Mikroskops von Binnig und Rohrer



(XYZ: Piezodreibein zur Feinpositionierung; L: Laus zur Grobpositionierung; S: Probe; PP: Piezoplatte; MF: Metallfuß; I: Isolatorschicht; GP: Grundplatte)

Prinzipaufbau moderner SPM-Geräte





Piezoelektrische Aktuatoren: a) Ausnutzung des Quereffekts, b) Ausnutzung des Längseffekts bei einem Stapel von Piezoplättchen, c) Bimorph, d) Rohrscanner